アドバンテスト D2T 寄附研究部門

東京大学　大規模集積システム設計教育研究センター
VLSI Design and Education Center VDEC

第14回 D2Tシンポジウム

Design to Test Structures and Verification for AI, photonics and nanorobot

東京大学大規模集積システム設計教育研究センターでは、株式会社アドバンテストからの寄附によるアドバンテストD2T寄附研究部門において、「D2T (Design-to-Test)」の理念に基づき、「設計」と「テスト」の橋渡しを目的とした研究・教育活動を行なっています。その一環として開催して参りました D2Tシンポジウムを今年も下記の通り開催いたします。当日までに招待講演者が増える可能性もありますので、HP でのご確認をどうぞよろしくお願いいたします。

2019 9/6 FRI
10:00-18:00

東京大学　武田先端知ビル 5 階
武田ホール

Keynote Speakers

Alan Mishchenko
Full researcher,
Electrical Engineering and Computer Sciences,
University of California, Berkeley,
"Circuit-Based Intrinsic Methods to Detect Overfitting"

Gilgueng Hwang
Associate Professor,
Centre for Nanoscience and Nanotechnology,
University Paris-Saclay, France,
"Design, Fabrication and Characterizations of On-chip Micro/nanorobotic Swimmers Toward Biological Applications"

Degang Chen
Professor,
Jerry R. Junkins Chair in Electrical and Computer Engineering, Iowa State University
"Effective and practical AMS DfT techniques for achieving robust performance and life-time reliability"

Tsung-Hsien Lin
Professor,
National Taiwan University,
"Sensor Readout Circuits for IoT/Bio-Medical Applications"

K.-T. Tim Cheng
Professor,
Hong Kong University of Science and Technology,
"Electronic-Photonic Design Automation"

Priyank Kalla
Professor,
The University of Utah,
"On Rectification of Arithmetic Circuits with Algebraic Geometry"

Adit Singh
Professor,
Auburn University,
"The Next Major Test Challenge: Low Power Designs"

参加のお申し込み 参加費：無料 懇親会：無料

申し込み方法：下記ウェブサイトで事前申込をお願いします
http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/d2t/D2Tsymposium2019-j.html

主催：東京大学大規模集積システム設計教育研究センター（VDEC）
後援：株式会社アドバンテスト
協賛（予定）：（一社）電子情報通信学会、（一社）情報処理学会、IEEE SSCS Japan Chapter
IEEE SSCS Kansai Chapter、応用物理学会 集積化 MEMS 技術研究会
ナノテスティング学会、（一社）電子情報技術産業協会、（一社）日本半導体製造装置協会
SEMI ジャパン、（一社）パワーデバイス・イネーブリング協会
計測エンジニアリングシステム株式会社

お問い合わせ：東京大学 大規模集積システム設計教育研究センター アドバンテスト D2T 寄附研究部門
〒113−0032　東京都文京区弥生 2−11−16　武田先端知ビル 404 号室
Tel: 03-5841-0233 FAX: 03-5841-1093
http://www.vdec.u-tokyo.ac.jp/　E-Mail: higo@if.t.u-tokyo.ac.jp